

非侵襲性を実現する光磁界測定

川崎市 知的財産交流会成果 NEC特許を活用



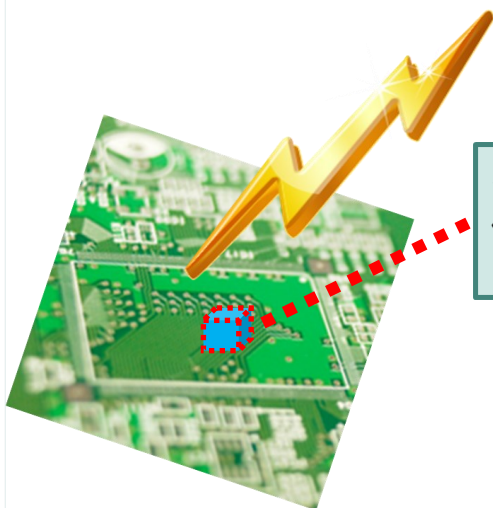
メタルフリー・光磁界測定装置

特徴

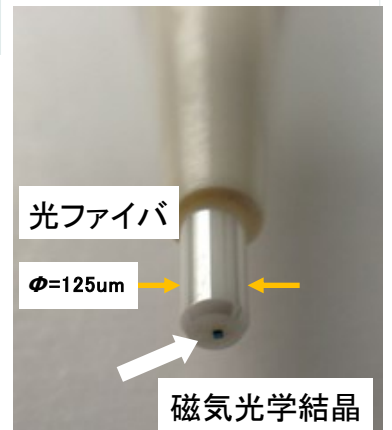
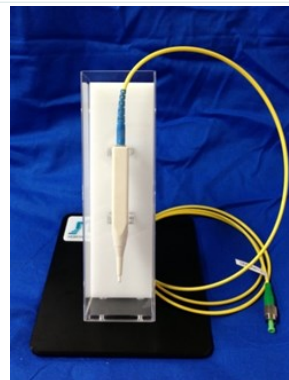
- 磁気光学結晶センサー NEC特許第5590340号
- 光ファイバセンサーによる磁界測定
 - ※磁界強度を光強度に変換し、磁界測定
 - ※非侵襲性・メタルフリーが必要な磁界測定
- 周波数範囲:(DC-1MHz) 周波数拡張開発中
- 光学装置1BOX化 開発予定(H27年度)
- ものづくり試作開発補助金・中小企業活性化補助金事業

開発中

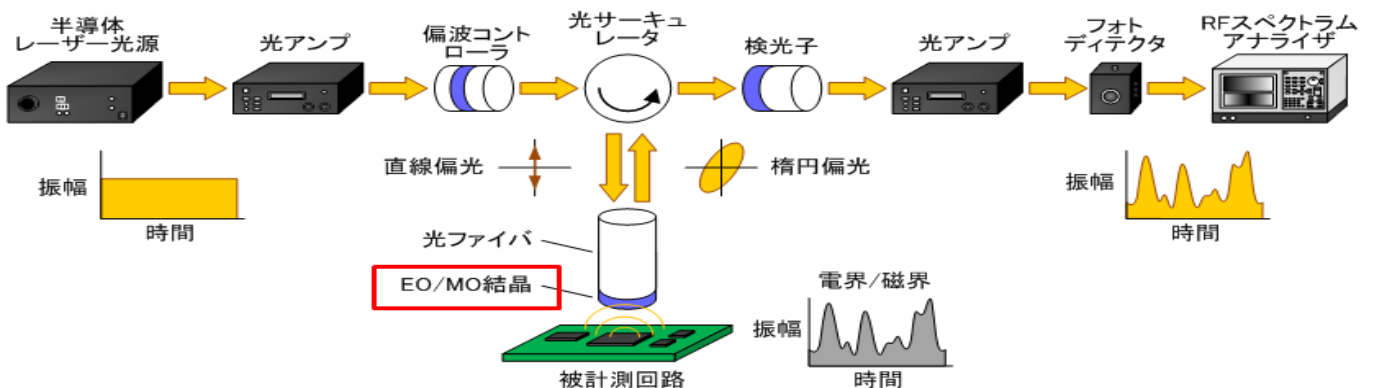
アプリケーション例: イミュニティ試験時の局所電磁界強度モニタリング
シングルモード光ファイバ+磁気光学結晶→メタルフリーを実現



SMファイバと
磁気光学結晶
(先端)



光計測装置 開発中(イメージ)



森田テック株式会社 〒206-0804 東京都稲城市百村2113-4 TEL:042-401-6330